談 話 室

第 27 回表面科学基礎講座

—表面・界面分析の基礎と応用—

林 泰 夫

旭硝子(株) 中央研究所
 ☎ 221-8755 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町 1150
 (1999 年 9 月 30 日受理)

The 27th Surface Science Lecture Course

Yasuo HAYASHI

Research Center, Asahi Glass Co., Ltd.
 1150 Hazawa-cho, Kanagawa-ku, Yokohama,
 Kanagawa 221-8755

(Received September 30, 1999)

第 27 回表面科学基礎講座が 1999 年 6 月 30 日から 7 月 2 日までの 3 日間、東京御茶ノ水の総評会館において開催された。本講座は、表面・界面分析の基礎と応用を入門的に具体例をあげて解説することを目的に、春季東京、秋季関西の年 2 回開催されている。今回で 27 回を数える本講座は、回を重ねるごとにアンケート結果の反映等によりプログラム、講義内容ともに洗練されたものとなり、表面・界面にかかわる研究者および技術者にとっては、その評価に関する基礎知識を得るための絶好の機会といえよう。今回の基礎講座には、分析技術者に加えて表面・界面制御に関係する研究開発者など 103 名が受講し、入門講座として幅広く認知されてきたと感ずる。

プログラムは、分析手法別の切り口で構成され、代表的かつ汎用的な分析手法は、ほとんど網羅されたものとなっている(表 1)。各講義は、第一線でご活躍中の先生方が講師となり、分析方法の原理、特徴から測定、解析上の注意点まで具体例でわかりやすく解説された。最後の総合討論では、最終日の講師がパネラーとなり、受講生が日々直面している問題や疑問点についても活発な討論がなされた。

では、受講者アンケートの集計結果を一部紹介すると、受講者は 30 代前半で化学/応用化学が専門の開発研究業

務に従事する人が多く、基礎を勉強したいというのが参加の動機であった。講座の開催頻度、時期、日数は現状で可とする意見が大多数を占め、本講座の基本スタイルは認められていると判断される。一方、内容はやや難しいと感じた人が多く、具体的には講師による難易度の差が大きいという意見を頂いた。検討事項として次回以降の企画に反映させていきたい。また、材料別講座開催の要望がこれまでと同様に今回も多く、日本表面科学会では企画委員会が中心となって、金属、半導体、ガラス等材料別の解析事例を紹介する表面科学セミナーを企画し、1999 年 10 月 21 日から 10 月 22 日までの 2 日間、東京中目黒の金属材料技術研究所において開催された。

今後の表面科学基礎講座の予定は、第 29 回が 2000 年 6 月 28 日から 6 月 30 日まで東京御茶ノ水の総評会館で開催される。表面・界面分析に関する基礎知識が十分に得られる表面科学基礎講座への参加をお勧めする。

最後に、本講座の講師の先生方および企画・運営にご協力いただいた企画委員会、事務局はじめ関係者の方々に紙面を借りて深く感謝する。

表 1 第 27 回表面科学基礎講座プログラム

1. 表面・界面分析概論	福田安生(静大電子研)
2. 電子線回折	一宮彪彦(名大工)
3. X 線構造解析	水木純一郎(原研)
4. 電子顕微鏡による構造解析	板東義雄(無機材研)
5. 電子線マイクロアナライザ	奥村豊彦(日本電子)
6. 電子顕微鏡による微小部分分析	永田文男(日立サイエンス)
7. 走査プローブ顕微鏡	野副尚一(物質研)
8. 赤外、ラマン分光	石田英之(TRC)
9. イオン散乱	越川孝範(大阪電通大)
10. 電子分光装置の基礎	大岩 烈(アルバック・ファイ)
11. 測定データの取り扱い	太田英二(慶応大理工)
12. オージェ電子分光法	吉原一紘(金材技研)
13. X 線光電子分光法	田沼繁夫(ジャパニエナジー)
14. 二次イオン質量分析法(D-SIMS)	本間芳和(NTT)
15. 二次イオン質量分析法(S-SIMS)	工藤正博(成蹊大工)
16. 総合討論/まとめ	